

非接触電位計測装置

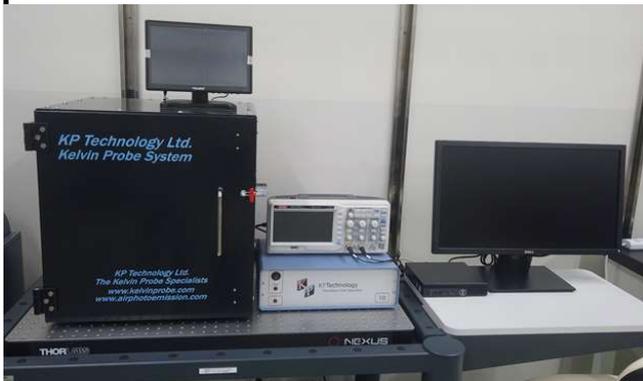


1. 装置の機能・特徴

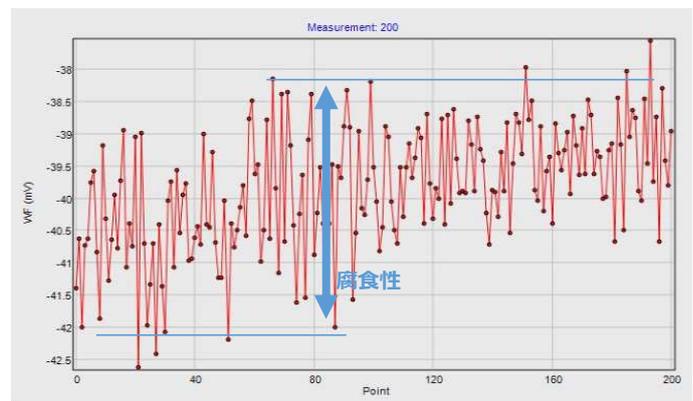
金属表面の腐食電位を非接触2次元で定量化可能

金属加工部の腐食性を定量的に示し、この防錆モデルと制御技術の開発指針を得る

【装置外観写真】



【計測事例】



金属表面の腐食性反応状態の実測状態

2. 主な仕様

型式 : SKP5050
メーカー : 株式会社 東京インスツルメンツ

(2)仕様

- ① ケルビンプローブ(KP)法にて相対仕事関数(表面電位)の測定が可能
- ② KP法の検出システム : Off-null(Baikie)法
- ③ チップの材質 : 金
- ④ プローブチップ径 : 50 μm 以上2 mm以下
- ⑤ 相対仕事関数の分解能 : 3 meV 以下
(2mm径チップ、標準サンプル測定時)
- ⑥ 走査ステージのXY走査範囲 : 50 mm x 50 mm

※本装置は「内閣府 地方大学・地域産業創生交付金」事業により導入しました。

広島大学 デジタルものづくり教育研究センター 材料MBRプロジェクト